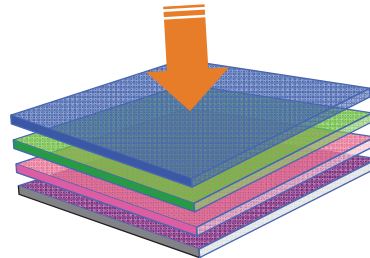
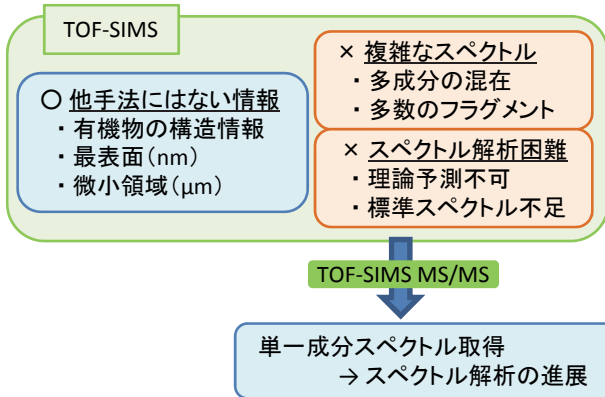


TOF-SIMS MS/MSによるOLED成分解析

OLED有機多層薄膜中のドーパント成分や極薄層(1~数nm)成分について、MS/MSスペクトル取得およびその解析による定性分析が可能である。従来実施できなかった詳細な化学構造情報の取得が可能である。

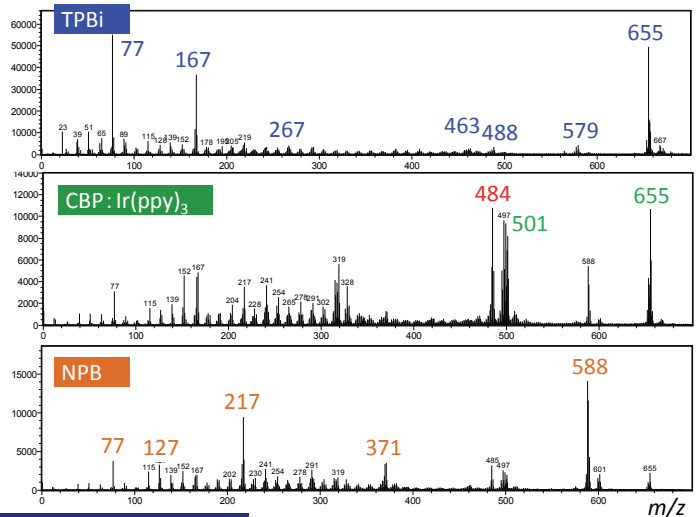
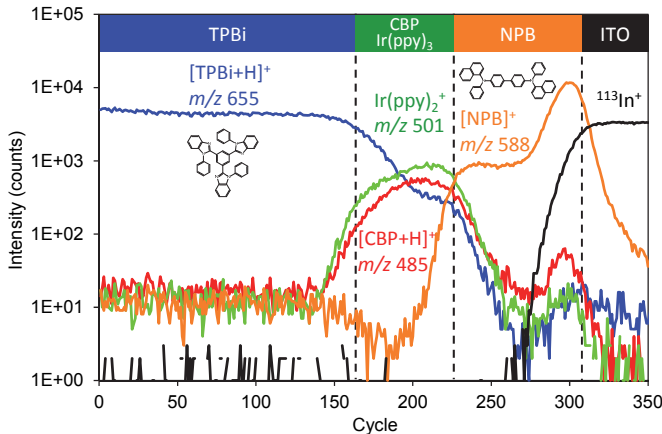


Al/TPBi/CBP:6% Ir(ppy)₃/NPB/ITO

→ Al陰極剥離後、GCIB-TOF-SIMS分析 → MS/MS分析

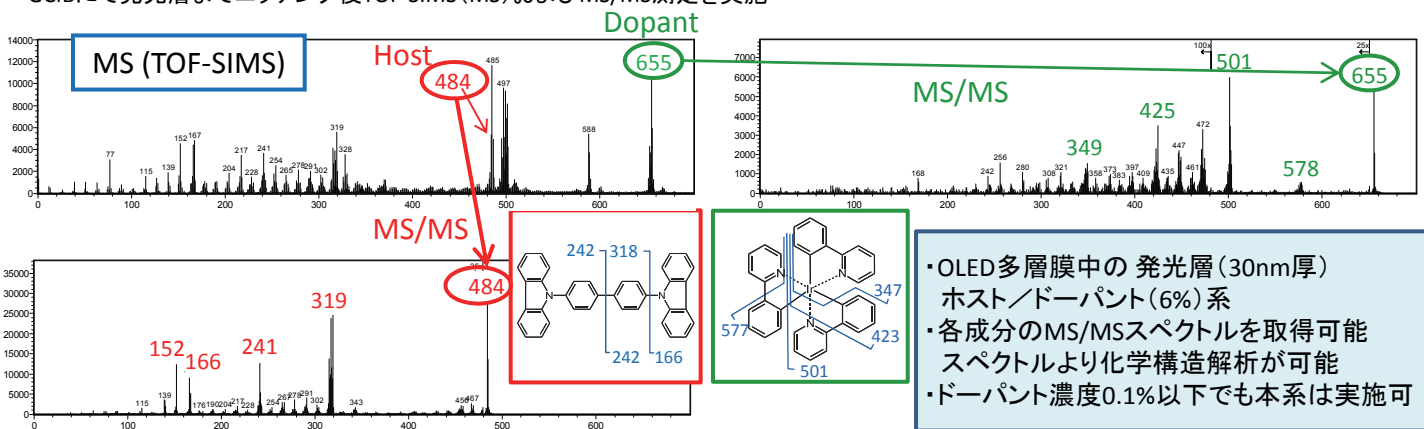
OLED多層膜のGCIB-TOF-SIMS分析

低ダメージエッチングによる、有機成分深さ分布・各層スペクトル取得



TOF-SIMS MS/MSによるホスト、ドーパントの各成分定性分析

GCIBにて発光層までエッチング後TOF-SIMS (MS)およびMS/MS測定を実施



- ・GCIB-TOF-SIMS分析では、ホストとドーパントの混在したスペクトルのみ得られ、解析が困難となる。
- ・TOF-SIMS MS/MSにより、各成分のMS/MSスペクトルの取得が可能
- ・GCIB-TOF-SIMS分析において前後層との分離が十分でない極薄層(1~数nm)の成分定性にも有効